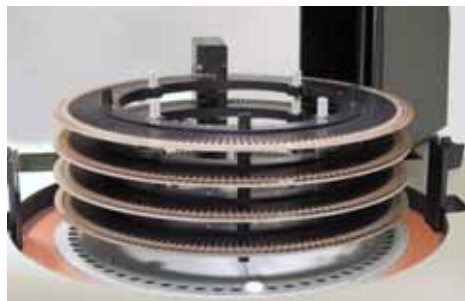


- 自動化されたソフトウェアベースの水晶振動子温度テストシステムです。
- 最高4枚のディスクパレットが積み重ね可能です。
- 利用可能なSMDの標準サイズ:

| SMDタイプ      | ディスクの収容数 | チャンバー内の総収容数 |
|-------------|----------|-------------|
| 5 x 7mm     | 140      | 560         |
| 4.5 x 8mm   | 140      | 560         |
| 3.5 x 6mm   | 160      | 640         |
| 3.2 x 5mm   | 160      | 640         |
| 2.5 x 4mm   | 160      | 640         |
| 2.5 x 3.2mm | 160      | 640         |
| 2.0 x 2.5mm | 160      | 640         |
| HC-49USMD   | 100      | 400         |
| リードタイプ      | 100      | 400         |

- SMDのカスタムサイズも利用可能です。
- チャンバー内部に搭載された高速ファンは、より速い温度浸漬(シンシ)タイムを提供します。
- ディスクパレットは、SMDデバイスの配置/取り外しを自動的にを行う専用マシンとの結合が非常に容易です。



- 75以上の異なるパラメータで測定可能です。
- パラメータとカーブフィット特性は、品質管理(QC)の制限を定義することが容易です。
- 異なる周波数の水晶振動子を一回の温度テスト内でテストが可能です。
- 全てのデータは、Microsoft Access™ データベースで公開され、カスタムデータ解析のためにMicrosoft Excel™にエクスポートが可能です。
- Crystal Reports® を使用した印刷が可能です。

### 仕様

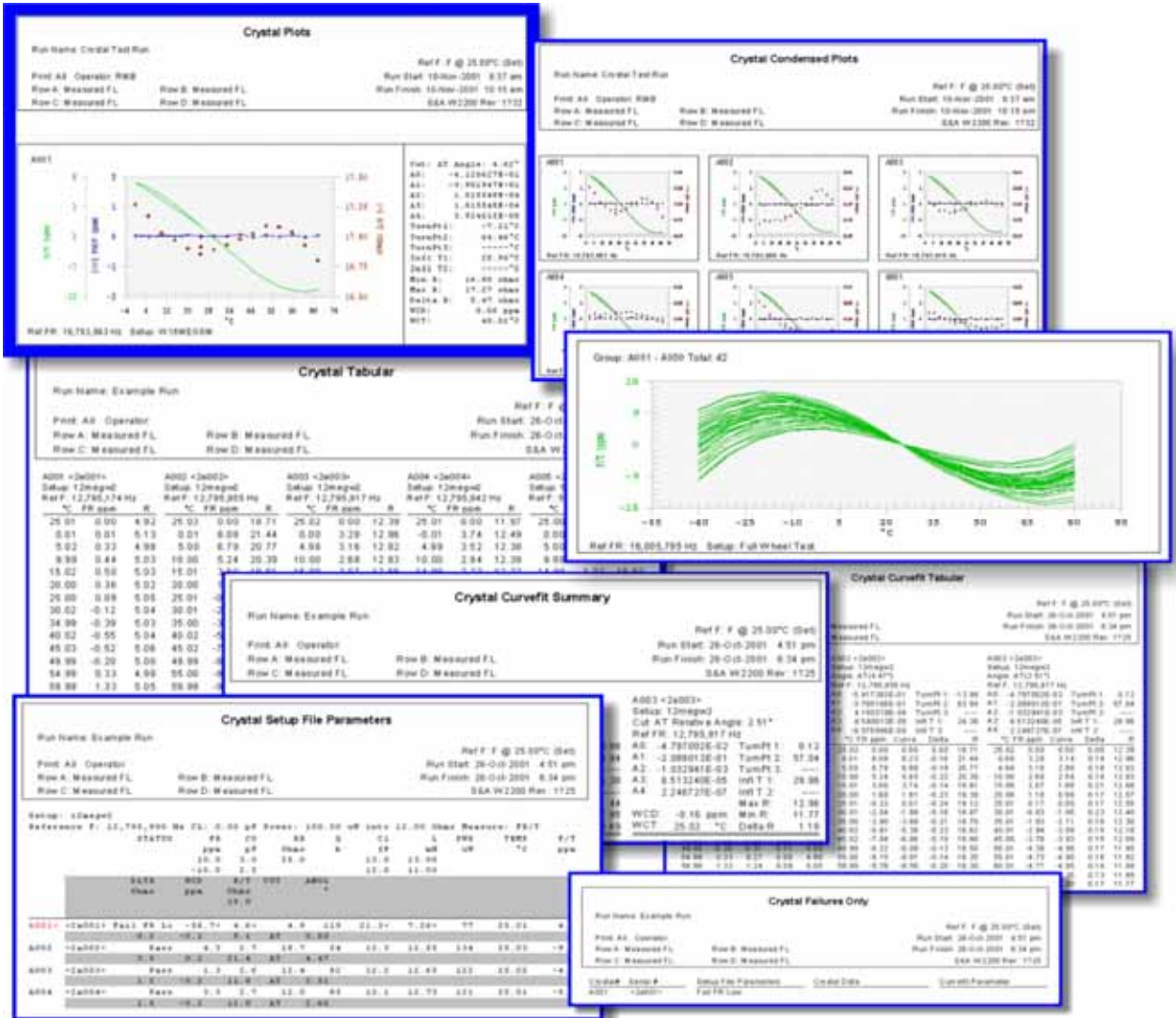
|             |  |
|-------------|--|
| 250B-1周波数帯: | 15KHzから220MHz  |
| 250C 周波数帯:  | 15KHzから500MHz  |
| 周波数相関性:     | 直列共振にての典型値* ±1 ppm   |
| 水晶パワー:      | 1 nWから1000uW (1 MHzから50MHz)<br>1 nWから500uW (50MHz以上から200MHz) |
| 温度の安定度:     | ±0.1   |

\* 弊社計測法及び計測アルゴリズムは、業界標準水晶計測装置に相関性を提供します。

## システム構成

- 250B-1または250Cネットワークアナライザー
- S&A 2451 スイッチコントローラー
- S&A 4220 温度テストチャンバー (LCO<sub>2</sub>, LN<sub>2</sub>, またはメカニカル冷却制御)
- IEC-444規格のPi ネットワークテストヘッド
- Windows® ベースのシステムソフトウェア
- プリンター (オプション)
- パソコンの要求スペック:  
 CPU: 500 MHz Pentium III以上の処理速度  
 フルサイズ及びショートサイズのPCIスロット×各1  
 (+3.3V & 5Vの電力が必須)  
 OS: Windows XP®

## サンプルレポート



## サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774  
 E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web http://www.saunders-assoc.com